

## ■ バックグラウンド測定において、デッドタイムが大きい、もしくは低エネルギー側の計数が通常のコンプトンの計数に比べ、異常に大きい

FAQ No. : FAQ1200-009	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/10/30
対象検出器	Ge 半導体検出器全般	
キーワード	Ge 半導体検出器、バックグラウンド、デッドタイム、ディスクリ	

### 【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
原因	対策
バックグラウンド測定において、デッドタイムが大きい、もしくは低エネルギー側の計数が通常のコンプトンの計数に比べ、異常に大きい	
低エネルギー側のノイズを拾っている	<ul style="list-style-type: none"><li>・ノイズの原因を除去してください。(FAQ1200-003 参照)。</li><li>・ノイズをカットするレベルまでディスクリ(ファーストディスクリもしくは LLD(ローレベルディスクリミネータ)を上げて下さい。</li></ul>